



Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 3754/89 (51) Int. Cl. 5: G 01 N 27/02
(22) Indleveringsdag:.... 31 jul 1989 G 01 R 27/00
(24) Løbedag:..... 31 jul 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 02 feb 1990
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 01 aug 1988 US 226709
(71) Ansøger: *Hughes Aircraft Company, 7200 Hughes Terrace; Los Angeles; California 90045-0066, US
(72) Opfinder: Frank A. *Ludwig, 29443 Whitley Collins; Rancho Palos Verdes; California 90274, US
John *McHardy, 2338 Stormcroft Ct.; Westlake Village; California 91361, US
(74) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630, Taastrup

- (54) Fremgangsmåde til ikke-destruktiv vurdering af printkort
(57) Sammendrag

3754-89

Fremgangsmåden går ud på at måle impedanskarakteristikken mellem et ledermønster på et printkort og et andet ledermønster ved frekvenser mellem 0,1 MHz og 20 kHz. Fremgangsmåden er nyttig til vurdering af diverse karakteristika, såsom fugtindhold, delaminering, mellemlagstykkelse og overfladetilstand. Vekselstrømsimpedansen mellem to ledermønstre på et printkort (18) måles under anvendelse af et konventionelt udstyr omfattende en PC (10), med disc-drives (12), en printer (14) og et katodestrålerør (16), et potentiostat (20) med interface plug-in (22), en computerstyret indkoblingsenhed (24), en elektrometersonde (21) og modelektrode-ledning (23).

